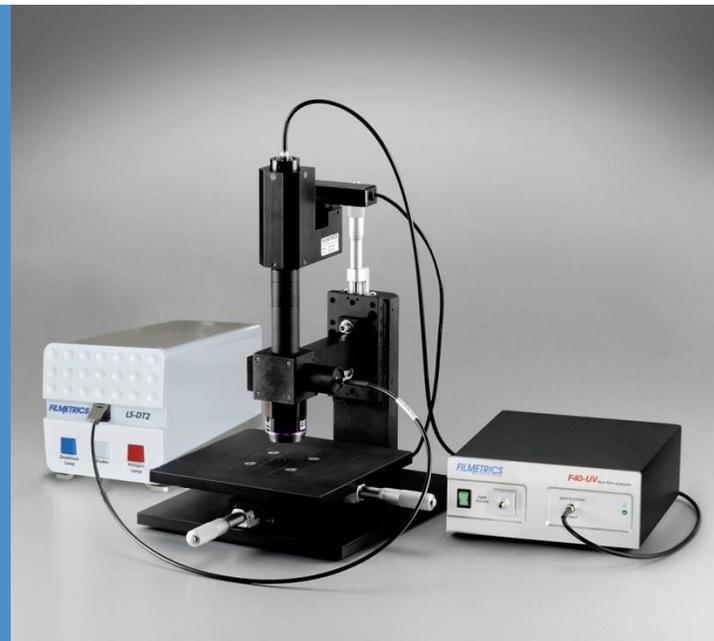


# F40

## 薄膜厚度测量仪



Filmetrics F40 SS-Microscope-VIS-1 系统



Filmetrics F40-UV SS-Microscope-UVX-1 系统

### 结合显微镜的薄膜测量系统

Filmetrics 的精密光谱测量系统让用户简单快速地测量薄膜的厚度和光学常数，通过对待测膜层的上下界面间反射光谱的分析，几秒钟内就可测量结果。

当测量需要在待测样品表面的某些微小限定区域进行，或者其他应用要求光斑小至 1 微米时，F40 是最好的选择。使用先前足部校正显微镜的物镜，再进行测量，即可获得精准的厚度及光学参数值。只要透过 Filmetrics 的 C-mount 连接附件，F40 就可以和市面上多数的显微镜连接使用。C-mount 上装备有 CCD 摄像头，可以让用户从电脑屏幕上清晰地看到样品和测量位置。

#### 相关应用

##### 半导体制造

- 光刻胶
- 氧化物/氮化物
- 硅或其他半导体膜层

##### 微电子

- 光刻胶
- 硅膜
- 氮化铝/氧化锌薄膜滤镜

##### 生物医学原件

- 聚合物/聚对二甲苯
- 生物膜/气泡墙厚度
- 植入药物涂层

##### 液晶显示器

- 盒厚
- 聚酰亚胺
- 导电透明膜

### Filmetrics 优势

- 桌面型薄膜厚度测量的全球领导者
- 24 小时电话、Email、在线技术支持
- 直观的分析软件

### 附加特性

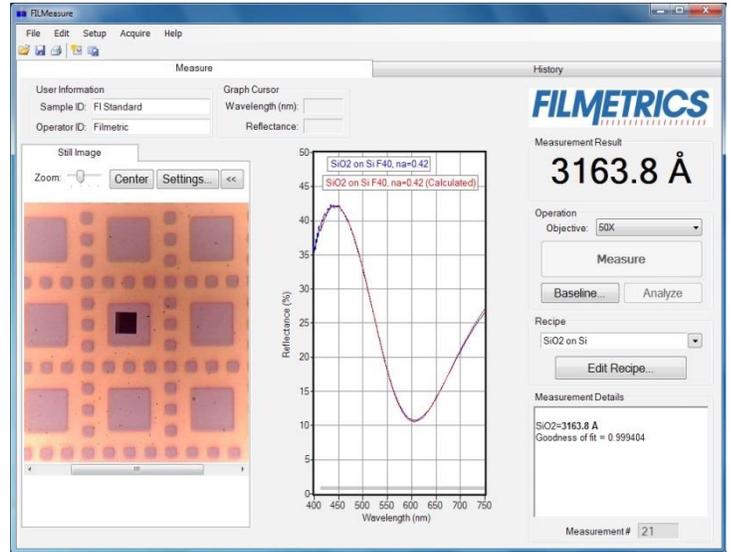
- 嵌入式在线诊断方式
- 免费离线分析软件
- 精细的历史数据功能，帮助用户有效的存储，重现与绘制测试结果

### 免费现场演示/支持

点几下鼠标就可以在网络上在线看到现场演示！请联系我们，我们的应用工程师会在电脑上为您演示薄膜测量是多么容易！

# F40

## 薄膜厚度测量仪



测量规格	F40-UV	F40-UVX	F40	F40-EXR	F40-NIR	F40-XT	F40-XXT
2X 物镜测量范围*:	-	-	20nm-50µm	20nm-150µm	40nm-150µm	0.2µm-300µm	5µm-450µm
5X 物镜测量范围*:	-	-	20nm-40µm	20nm-120µm	40nm-120µm	0.2µm-250µm	5µm-375µm
10X 物镜测量范围*:	-	-	20nm-35µm	20nm-70µm	40nm-70µm	0.2µm-100µm	5µm-100µm
15X 物镜测量范围 <sup>4</sup> *:	4nm-30µm	4nm-100µm	20nm-40µm	20nm-100µm	40nm-100µm	0.2µm-120µm	5µm-120µm
50X 物镜测量范围*:	-	-	20nm-2µm	20nm-4µm	40nm-4µm	0.2µm-4µm	-
100X 物镜测量范围*:	-	-	20nm-1.5µm	20nm-3µm	40nm-3µm	0.2µm-3µm	-
测量 n 和 k 值得厚度要求 <sup>1</sup> *:	50nm	50nm	100nm	100nm	500nm	2µm	100µm
准确度*: 大于 0.2%或	1nm	1nm	2nm	2nm	3nm	5nm	50nm
精度 <sup>2</sup> :	0.02nm	0.02nm	0.02nm	0.02nm	0.1nm	1nm	5nm
稳定性 <sup>3</sup> :	0.05nm	0.05nm	0.05nm	0.05nm	0.12nm	1nm	5nm
<b>光谱仪</b>							
波长范围:	200-1100nm	200-1700nm	400-850nm	400-1700nm	950-1700nm	1440-1690nm	1520-1580nm
光源:	内部显微镜光源						
电源:	100-240 VAC, 50-60 Hz, 20 W						

斑点尺寸	标准 500 毫米孔径	可选 250 毫米孔径	可选 100 毫米孔径	电脑要求
5X 物镜	100 微米	50 微米	20 微米	处理器速度
10X 物镜	50 微米	25 微米	10 微米	接口
50X 物镜	33 微米	17 微米	7 微米	1.4GHZ 以上
50X 物镜	10 微米	5 微米	2 微米	USB2.0
100X 物镜	5 微米	2.5 微米	1 微米	

\* 取决于材料

<sup>1</sup> 使用 5X 物镜参考

<sup>2</sup> 标准偏差为一天内在 Si 基底上对厚度为 500 纳米的 SiO 薄膜样品连续测量 100 次所得厚度值的标准偏差。该值为连续 20 天测量的标准偏差值的平均值。

<sup>3</sup> 2σ 是基于连续 20 天，每天在基底上对厚度为 500 纳米的 SiO<sub>2</sub> 薄膜样品连续测量 100 次所得厚度值上得出。



优尼康科技有限公司

- Filmetrics 薄膜厚度测量系统专业代理商

联系方式: 李先生 15900490105

盘先生 15989637322

Email: Info@unicorn-tech.com

Web: www.unicorn-tech.com

内容如有更改, 恕不另行通知 ©2014 Filmetrics, Inc